

电子元件-内部目检(单片)测试-百检网

产品名称	电子元件-内部目检(单片)测试-百检网
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网入驻的检测机构业务覆盖全检测行业。在线一对一服务。检测报告按时按质送到手，坐享报告配送服务：在百检平台上，客户从订购服务到提交委托信息到*后支付检测费用全都可以在线完成,不用出门就可以完成报检流程。报告按时按质送到手。百检平台致力于为企业及个人提供检测服务，利用互联网+检测电商，为客户提供多样化检测服务。

1 氦质谱仪背压检漏方法 QJ 3212-2005 5.2 漏率

2 电工电子产品环境试验 GB/T2423.1-2008 第2部分：试验方法 试验A：低温 低温试验

3 电工电子产品环境试验 GB/T2423.1-2008 第2部分：试验方法 试验A：低温 低温试验

4 半导体分立器件试验方法 GJB128A-1997 4.1.1 低温试验

5 半导体分立器件试验方法 GJB128A-97 4.1.1 低温试验

6 电子及电气元件试验方法 GJB360B-2009 4.2.1 低温试验

7 电子及电气元件试验方法 GJB360B-2009 4.2.1 低温试验

8 微电子试验方法和程序 GJB548B-2005 4.5.9.2 低温试验

9 微电子试验方法和程序 GJB548B-2005 4.5.9.2 低温试验

10 军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB4027A-2006 内部目检

11 军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB4027A-2006 制样镜检

12 军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB4027A-2006 剪切强度

13 军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB4027A-2006 可焊性

14 军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB4027A-2006 声学扫描显微镜检查

15 半导体分立器件试验方法 GJB128A-1997 方法2066 外形尺寸